

2026 年 9 月 10 日

致各位

公司名 尼得科精密检测科技株式会社
代表人 代表取締役社長 山崎 秀和
公司地址 京都府向日市 Nidec Park33 番地 C 栋

尼得科精密检测科技株式会社将参展 SEMICON INDIA 2026

尼得科精密检测科技株式会社（以下简称“本公司”）将参加于 2026 年 9 月 17 日（周四）至 9 月 19 日（周六）在印度新德里举办的半导体行业展会 SEMICON INDIA 2026。



本届展会是印度规模最大的半导体专业盛会，汇聚来自全球 20 个国家的 500 余家企业。本年度展会主题为“Transform Tomorrow: Silicon to Systems: Building the Ecosystem”，展品覆盖半导体材料至系统级全产业链。

本公司展台将展出依托前沿探针技术打造的探针卡，同时面向晶圆、芯片、基板、封装等各制造工序，推出电气检测与外观检测新一代解决方案。此外，针对电动化快速发展的汽车行业，我们同步展出可实现性能评估与耐久测试高效化的 TDAS 系列（电机/E-Axle 测试台），以及面向电动汽车整车设计与分析仿真的软件 E-Transport Simulator®。

〈参展概要〉

- ・展期：2026 年 9 月 17 日(周四)～9 月 19 日(周六)
- ・展馆：Yashobhoomi（印度国际会议展览中心）
- ・展位：H4305, Hall 2

〈展出产品〉

- － STAR REC 系列（服务器、通信、车载产品、电脑、智能手机基板检测设备）
- － GATS 系列（半导体封装自动检测设备）
- － NATS 系列（IGBT/SiC 模块绝缘/静态特性/动态特性检测设备）
- － RWi-300MK3（2D/3D 晶圆凸点检测设备）
- － AURCA 系列（3D/AFVI AI 视觉检测系统）

- RSH 系列（适配高密度基板的 2D/3D 检测设备）
- 高精度检测治具
- TDAS 系列（电机/E-Axle 测试台）
- E-Transport Simulator®（xEV 整车建模仿真软件）
- 探针卡（半导体晶圆检测用）